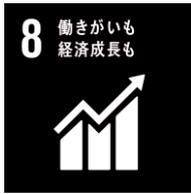


瀬戸市記者会、豊田市政記者クラブ、  
豊田市政記者東クラブ同時



本事業は、SDGsの「8 働きがいも経済成長も」「9 産業と技術革新の基盤をつくろう」に資する取組です。

2023年6月16日(金)

あいち産業科学技術総合センター

共同研究支援部計測分析室

担当 杉本、内田、中尾

ダイヤルイン 0561-76-8315

愛知県経済産業局産業部産業科学技術課

管理・調整グループ

担当 田中、岡田

内線 3388、3380

ダイヤルイン 052-954-6347

## 計測分析に関する講演会

### 「元素分析の基礎－異物分析や品質管理での活用を目指して－」の 参加者を募集します

あいち産業科学技術総合センター(豊田市)では、種々の分析機器を用いた分析、評価により、企業の方々の新技術や新製品開発、ものづくりの現場で発生する様々な課題の解決を支援しています。

このうち、共同研究支援部では、企業の皆様の異物分析や品質管理に活用できる、微小部蛍光X線分析装置\*1、走査電子顕微鏡\*2、X線光電子分光装置\*3などの元素分析機器を運用しています。

この度、企業の皆様の異物分析や品質管理などに役立てていただくことを目的として、これらの活用事例を中心とした講演会を開催します。また、当日は分析法などについて個別相談会を開催します(希望者のみ)。

参加費は無料です。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

#### 1 日時

2023年7月11日(火) 午後1時から午後5時10分まで (受付開始: 午後0時30分)

#### 2 場所

あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

豊田市八草町秋合1267-1 電話: 0561-76-8315

(東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ)

#### 3 定員

80名(申込先着順)

#### 4 参加費

無料

## 5 内容

時間	内容
13:00～13:10	開会挨拶 あいち産業科学技術総合センター 所長 <small>なかがわ ゆきおみ</small> 中川 幸臣
13:10～14:10	「微小部蛍光X線の原理と最新技術のご紹介」 ブルカージャパン株式会社 <small>みずひら まなぶ</small> 水平 学 氏
14:10～14:20	休憩
14:20～15:20	「SEM-EDS分析入門」 株式会社日立ハイテク 中部支店 <small>にむら かずたか</small> 二村 和孝 氏 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 <small>あ え とおる</small> 阿江 啓 氏
15:20～15:30	休憩
15:30～16:30	「表面分析法の基礎と応用 XPSとTOF-SIMSを中心に」 アルバック・ファイ株式会社 <small>ほし たかひろ</small> 星 孝弘 氏
16:30～16:40	「共同研究支援部における元素分析機器の活用について」 あいち産業科学技術総合センター <small>すぎもと たかのり</small> 杉本 貴紀
16:40～17:10	個別相談会(希望者のみ)

## 6 対象

品質管理や製品開発に携わる企業の方々をはじめ、どなたでも自由に参加できます。

## 7 申込方法

次のいずれかの方法により、お申込みください。

※申込時点で定員に達していた場合は、電話又はメールにて早急にお断りの連絡をします。

### (1) Webページ

以下のURL又は二次元コードからセンターのWebページにアクセスし、「計測分析に関する講演会」の申込フォームに御記入ください。また、個別相談の希望の有無も必ず備考欄に御記入ください。

申込後に自動返信メールにて確認メールを送信します。

<https://www.aichi-inst.jp/acist/other/seminar/>



二次元コード

### (2) メール

件名を「計測分析に関する講演会7/11参加申込」とし、企業名、所在地、所属、氏名、電話番号、メールアドレス、個別相談の希望の有無を記入の上、「10申込み・問合せ先」までお送りください。

## 8 申込期限

2023年7月7日(金) 午後5時

申込期限前でも定員になり次第締め切ります。その際はセンターのWebページでお知らせします。

<https://www.aichi-inst.jp/>

## 9 主催

愛知県、公益財団法人科学技術交流財団

## 10 申込み・問合せ先

あいち産業科学技術総合センター共同研究支援部

計測分析室(担当：杉本、内田、中尾)

豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315

メール：seminar@chinokyoten.pref.aichi.jp

### 【用語説明】

#### ※1 微小部蛍光X線分析装置

材料にX線を照射することで発生する特性X線を検出することで元素分析を行う装置。従来の蛍光X線分析装置と比較し、照射X線径が非常に小さいため微小領域の分析や面分析が可能。

#### ※2 走査電子顕微鏡

材料に絞った電子線を照射し、表面の形状を観察する装置。SEM(Scanning Electron Microscope)とも呼ばれる。エネルギー分散型蛍光X線検出器(EDS：Energy Dispersive x-ray Spectroscopy)を搭載すると元素分析も可能となる。

#### ※3 X線光電子分光装置

材料表面にX線を照射し、放出される光電子を信号として検出する装置。XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)とも呼ばれる。光電子の結合エネルギーや強度から、ごく表面の物質を構成する元素やその元素の酸化、還元など化学的な状態を知ることができる。